岩矿鉴定报告单

薄片号: WL-S11r-2

野外名称: 泥质砂岩不对称波痕。

采样地点: 五龙一文化。

显微镜下薄片鉴定描述:

变余细砂粉砂质硅泥状结构。

岩石由细砂、粉砂、硅质矿物、浅变质泥质等组成。

细砂、粉砂(25%): 形状多为棱角状、次棱角状,磨圆度差; 粒度多小于0.05(mm)、为粉砂(15%+),少为0.05-0.10(mm)、为较细的细砂(10%-);种类以石英占优,极少白云母碎片、磁铁矿(褐铁矿化)。

细砂、粉砂分布不均匀,成微层状平行分布,使岩石显示层理构造。

硅质矿物(25%+): 微晶、隐晶状; 粒度小于 0.005 (mm); 主要为隐晶、微晶石英,可能含蛋白石等,为原生沉积硅质矿物,变质重结晶程度极低。

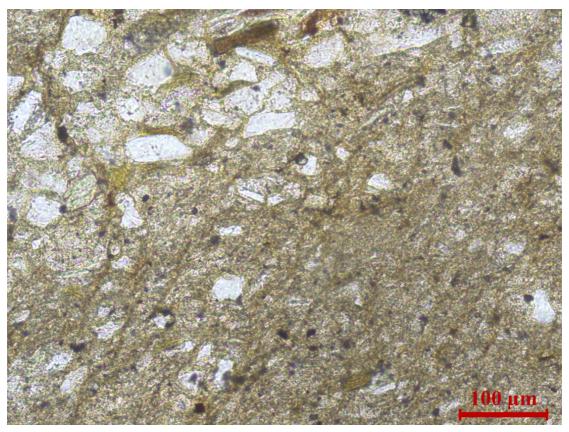
浅变质泥质(50%-):原岩泥质经浅变质结晶为泥状、显微鳞片状绢云母和泥状绿帘石等,分布无明显定向性,成为硅质矿物的基底。部分绿帘石褐铁矿化,使岩石带淡褐色调。

原岩:细砂粉砂质硅泥岩。

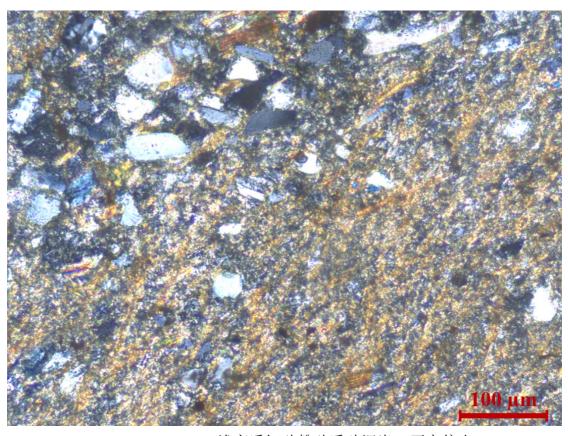
变质、蚀变: 低级区域变质。

显微镜下鉴定命名: 浅变质细砂粉砂质硅泥岩。

鉴定人: 曾广策 **鉴定日期:** 2019 年 6 月 26 日



11-1, WL-S11r-2, 浅变质细砂粉砂质硅泥岩。单偏光。



11-2, WL-S11r-2, 浅变质细砂粉砂质硅泥岩。正交偏光。